

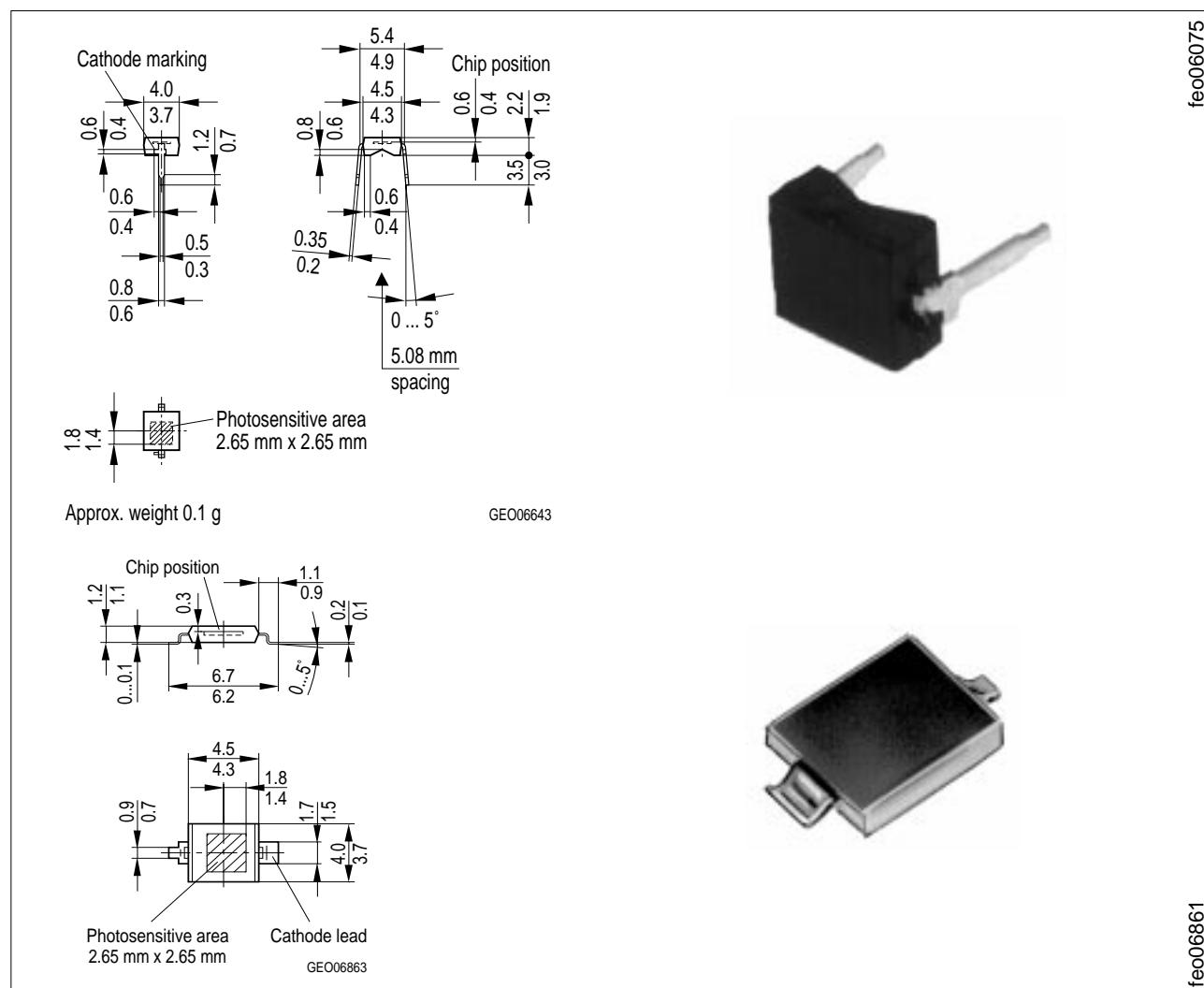
Silizium-PIN-Fotodiode mit Tageslichtsperrfilter

NEU: in SMT

Silicon PIN Photodiode with Daylight Filter

NEW: in SMT

BPW 34 F
BPW 34 FS



Maße in mm, wenn nicht anders angegeben/Dimensions in mm, unless otherwise specified.

Wesentliche Merkmale

- Speziell geeignet für Anwendungen bei 950 nm
- kurze Schaltzeit (typ. 20 ns)
- DIL-Plastikbauform mit hoher Packungsdichte
- BPW 34 FS: SMT-Version und Ersatz für BP 104 BS; geeignet für Vapor-Phase Löten und IR-Reflow Löten

Anwendungen

- IR-Fernsteuerung von Fernseh- und Rundfunkgeräten, Videorecordern, Gerätefernsteuerungen
- Lichtschranken für Gleich- und Wechsellichtbetrieb

Features

- Especially suitable for applications of 950 nm
- Short switching time (typ. 20 ns)
- DIL plastic package with high packing density
- BPW 34 FS: SMT version and replacement for BP 104 BS; suitable for vapor-phase and IR-reflow soldering

Applications

- IR remote control of hi-fi and TV sets, video tape recorders, remote controls of various equipment
- Photointerrupters

Typ Type	Bestellnummer Ordering Code
BPW 34 F	Q62702-P929
BPW 34 FS	Q62702-P1604

Grenzwerte
Maximum Ratings

Bezeichnung Description	Symbol Symbol	Wert Value	Einheit Unit
Betriebs- und Lagertemperatur Operating and storage temperature range	$T_{op}; T_{stg}$	- 40 ... + 85	°C
Sperrspannung Reverse voltage	V_R	32	V
Verlustleistung, $T_A = 25$ °C Total power dissipation	P_{tot}	150	mW

Kennwerte ($T_A = 25$ °C, $\lambda = 950$ nm)
Characteristics

Bezeichnung Description	Symbol Symbol	Wert Value	Einheit Unit
Fotoempfindlichkeit Spectral sensitivity $V_R = 5$ V, $E_e = 1$ mW/cm ²	S	50 (≥ 40)	µA
Wellenlänge der max. Fotoempfindlichkeit Wavelength of max. sensitivity	$\lambda_{S \max}$	950	nm
Spektraler Bereich der Fotoempfindlichkeit $S = 10\%$ von S_{max} Spectral range of sensitivity $S = 10\%$ of S_{max}	λ	780 ... 1100	nm
Bestrahlungsempfindliche Fläche Radiant sensitive area	A	7.00	mm ²
Abmessung der bestrahlungsempfindlichen Fläche Dimensions of radiant sensitive area	$L \times B$	2.65 × 2.65	mm × mm
Abstand Chipoberfläche zu Gehäuseober- fläche Distance chip front to case surface	H	0.5 0.3 (BPW 34 FS)	mm

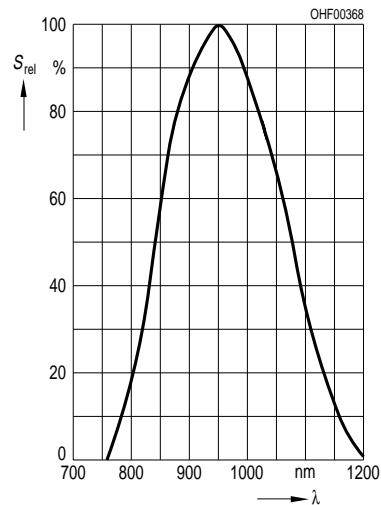
Kennwerte ($T_A = 25^\circ\text{C}$, $\lambda = 950 \text{ nm}$)

Characteristics (cont'd)

Bezeichnung Description	Symbol Symbol	Wert Value	Einheit Unit
Halbwinkel Half angle	ϕ	± 60	Grad deg.
Dunkelstrom, $V_R = 10 \text{ V}$ Dark current	I_R	2 (≤ 30)	nA
Spektrale Fotoempfindlichkeit Spectral sensitivity	S_λ	0.59	A/W
Quantenausbeute Quantum yield	η	0.77	Electrons Photon
Leerlaufspannung, $E_e = 0.5 \text{ mW/cm}^2$ Open-circuit voltage	V_O	330 (≥ 275)	mV
Kurzschlußstrom, $E_e = 0.5 \text{ mW/cm}^2$ Short-circuit current	I_{SC}	25	μA
Anstiegs- und Abfallzeit des Fotostromes Rise and fall time of the photocurrent $R_L = 50 \Omega$; $V_R = 5 \text{ V}$; $\lambda = 850 \text{ nm}$; $I_p = 800 \mu\text{A}$	t_r, t_f	20	ns
Durchlaßspannung, $I_F = 100 \text{ mA}$, $E = 0$ Forward voltage	V_F	1.3	V
Kapazität, $V_R = 0 \text{ V}$, $f = 1 \text{ MHz}$, $E = 0$ Capacitance	C_0	72	pF
Temperaturkoeffizient von V_O Temperature coefficient of V_O	TC_V	- 2.6	mV/K
Temperaturkoeffizient von I_{SC} Temperature coefficient of I_{SC}	TC_I	0.18	%/K
Rauschäquivalente Strahlungsleistung Noise equivalent power $V_R = 10 \text{ V}$	NEP	4.3×10^{-14}	$\frac{\text{W}}{\sqrt{\text{Hz}}}$
Nachweisgrenze, $V_R = 10 \text{ V}$ Detection limit	D^*	6.2×10^{12}	$\frac{\text{cm} \cdot \sqrt{\text{Hz}}}{\text{W}}$

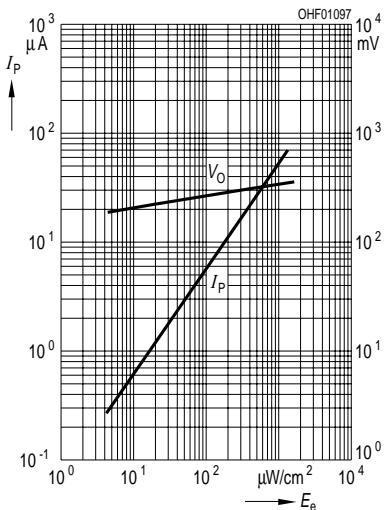
Relative spectral sensitivity

$$S_{\text{rel}} = f(\lambda)$$



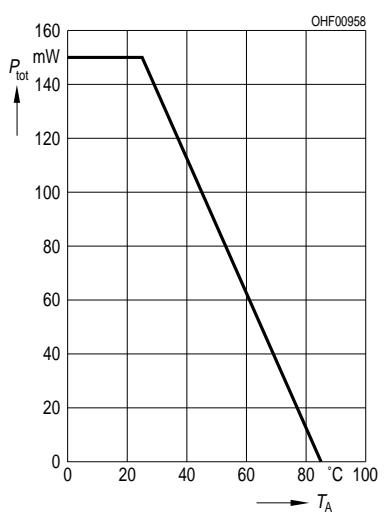
Photocurrent $I_P = f(E_e)$, $V_R = 5 \text{ V}$

$$V_O = f(E_e)$$



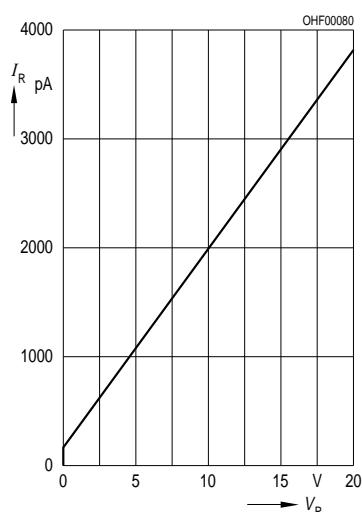
Total power dissipation

$$P_{\text{tot}} = f(T_A)$$



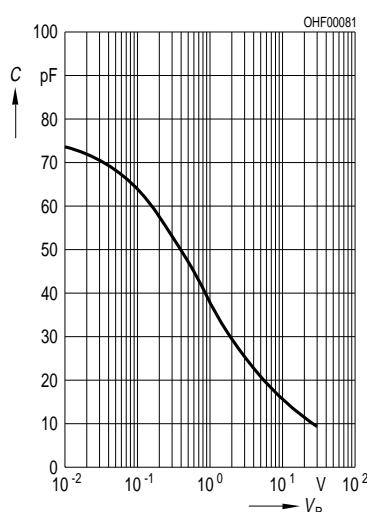
Dark current

$$I_R = f(V_R), E = 0$$



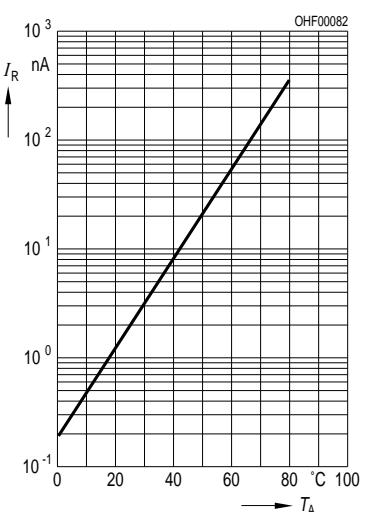
Capacitance

$$C = f(V_R), f = 1 \text{ MHz}, E = 0$$



Dark current

$$I_R = f(T_A), V_R = 10 \text{ V}, E = 0$$



Directional characteristics $S_{\text{rel}} = f(\phi)$

